

『生産システム関連の画像応用技術』

目次

1 . 講演	
「半導体計測・検査への画像処理技術の応用」..... 1	
(株)日立ハイテクノロジーズ ナノテクノロジー製品事業本部 那珂事業所 那珂アプリケーションセンタ	
	渡辺 健二 氏
2 . 講演	
「FPD検査装置の画像応用技術について」..... 9	
タカノ(株)エレクトロニクス部門 画像計測グループ 開発部	
	戸田 好実 氏
3 . 研究発表	
「電子ディスプレイの色むらグレード評価」..... 19	
広島工業大学	
	浅野 敏郎 氏、池田 年実 氏
4 . 事例紹介	
「大型FPDパネル点灯検査の自動化への取り組み」..... 25	
(株)ファースト	
	三谷 洋之 氏、劉 偉 氏、黒木 健司 氏
次回研究会案内	28

今回担当委員：

菅野委員(ファースト)、浅野委員(広島工大)、糊澤委員(旭硝子)、
肥塚委員(富士通)、輿水委員(中京大)、渋谷委員(日立製作所)、
高橋委員(香川大)、中村委員(東京電機大)、
野口委員(日立ハイテクノロジーズ)、村上委員(慶應義塾大)